

SOLICITUD DE ANALISIS POR XPS ¹

DATOS DEL SOLICITANTE/ FACTURACIÓN

Nombre y Apellidos:

@

Tlf

Equipo de trabajo CITIUS:

Responsable del equipo de trabajo CITIUS:

Nombre del proyecto al cual se le asigna el gasto:

DATOS DE LA MUESTRA ²

Composición química (formula aproximada):

Describir brevemente el objetivo del análisis a realizar:

Tipo de análisis que se solicita:

Registro del espectro general usando la radiación:

Radiación: Al K α Mg K α Ag L α

Registro de los espectros individuales (*por zonas*):

Indicar zonas a registrar: (p. ej. Zn2p; Zn AES; etc...)

Cálculo de la composición porcentual de elementos presentes en la superficie

¹ Se analizan hasta 4 muestras por solicitud

² Las muestras en polvo húmedas se someten a tratamiento térmico a 150°C antes de registrar el espectro.
En caso de muestras rígidas las dimensiones deben ser 11 x 8 mm.

ESPACIO RESERVADO PARA EL SERVICIO DE XPS

Fecha entrada:

Nº Registro:

Observaciones:

Sevilla

de

de

Firma:

Nombre y Apellidos:

NOTA: Remitir, junto con la muestra a analizar

Servicio de Espectroscopia XPS, email: sgi-servicioxps@us.es, Tlf: 954550129

(atte. Antonio Macías Pérez, técnico del servicio)

Centro de Investigación, Tecnología E Innovación Universidad de Sevilla (C.I.T.I.U.S.),

Avda. Reina Mercedes nº 4-B 41012

@ sgi-servicioxps@us.es // ☎ 954550129

📧 Apto. 1152, 41080 Sevilla, España

PNT07XPS0003-FT02 Rev.: 06